

# 耐クラック性に優れた無電解ニッケルめっき液

Electroless Nickel Plating Solution with Strong Crack Resistance

# トップUBPニコロンHR

TOP UBP NICORON HR

- リン含有率は1~2wt%と低く、硫黄を含有しない

Phosphorus content: 1 to 2% by weight, not containing sulfur

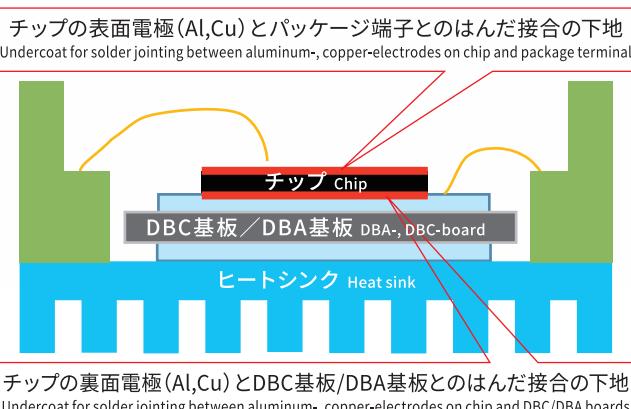
- 热処理後においても硬度が上昇しにくく、クラックが発生しにくい

Little change in hardness after heat-treatment, prevent cracks

- 析出皮膜は不動態化しにくく、経時によるはんだ濡れ性の低下が少ない

Tolerant to passivation, prevent poor solder wettability caused by time passage

## パワーデバイス用 Use for power device



## 低リン・硫黄フリー Low phosphorus content, sulfur-free

リン含有率 : EDS分析  
Phosphorus content : EDS analysis

硫黄含有率 : CS分析  
Sulfur content : CS analysis

	皮膜成分 Film component	
	リン含有率(wt%) Phosphorus content	硫黄含有率(wt%) Sulfur content
トップUBPニコロンHR TOP UBP NICORON HR	1.7	検出限界以下 Not detected
従来高リン皮膜 Conventional Ni-P bath (high phosphorus content)	10.4	検出限界以下 Not detected
従来低リン皮膜 Conventional Ni-P bath (low phosphorus content)	1.8	0.22
従来硫黄フリー低リン皮膜 Conventional (Sulfur-free, low-phosphorus content)	3.8	検出限界以下 Not detected

リンが約1.7wt%と低く硫黄を含まない  
Phosphorus content: approx. 1.7% by weight, sulfur-free film

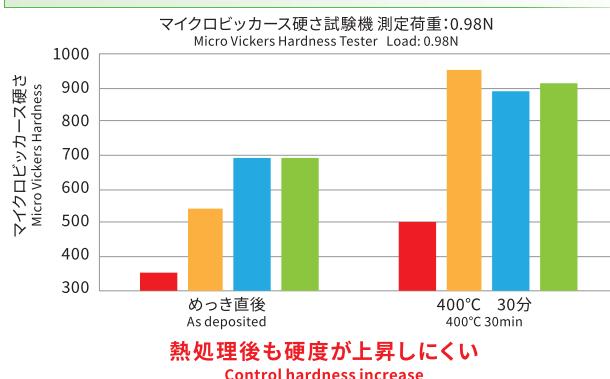
## 400°Cにおいても優れた耐クラック性 Prevent crack even under 400°C

### 熱処理後もクラックが発生しない Prevent cracks after heat treatment



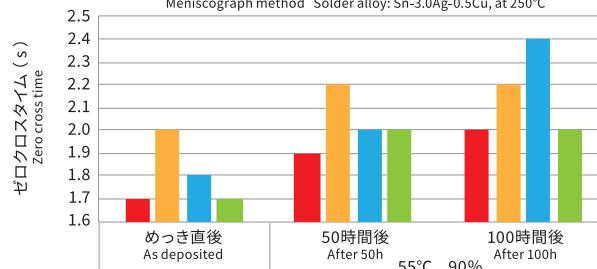
エリクセン塗膜強度試験機による押し込み試験後の外観比較 (ニッケル膜厚:3μm 押し込み幅:0.5mm)  
Indentation test by Erichsen tester (Nickel thickness: 3μm Indentation width: 0.5mm)

## 従来皮膜より低硬度 Lower film hardness



## 優れたはんだ濡れ性 Excellent in solder wettability

メンスコグラフ法によるゼロクロスマスク時間測定 250°Cに設定したSn-3.0Ag-0.5Cuはんだ槽へ浸漬  
Meniscograph method Solder alloy: Sn-3.0Ag-0.5Cu, at 250°C



経時においてはんだ濡れ性が低下しにくい  
Reduce impact by time change

トップUBPニコロンHR TOP UBP NICORON HR	従来高リン皮膜 Conventional Ni-P bath (high phosphorus content)	従来低リン皮膜 Conventional Ni-P bath (low phosphorus content)	従来硫黄フリー低リン皮膜 Conventional (Sulfur-free, low-phosphorus content)
------------------------------------	---	--	--